

## 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)

|                  |   |
|------------------|---|
| 製造元              | 日立ハイテクノロジーズ   |
| 仕様               | Regulus 8220、EDX 付属 (EMAXEvolution X-Max (80mm <sup>2</sup> ))  |
| 保有部署             | 化学系コアラボ (分子工学専攻)  |
| 設置場所             | 桂・A2 棟・B1 階 006 号室  |
| 利用期間・時間、<br>利用料金 | 本設備の共同利用規程を参照<br><a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/sg65gg/</a>  |
| 注意事項等            | 利用者登録の前に使用方法等に関する説明・講習を受けて頂く必要があります。<br>その後、利用者自身による測定となります。  |
| 連絡先              | 分子工学専攻今堀研究室<br>075-383-2567<br><a href="mailto:t-higa@scl.kyoto-u.ac.jp">t-higa@scl.kyoto-u.ac.jp</a>   |
| キーワード            | ナノ材料、組成分析、表面観察  |
| 機器コード            | (0000115002)  |
| 自由記入欄            | 本装置は、電子銃の高輝度化、信号検出系の高感度化が図られ、低加速電圧での高分解能/高コントラスト観察、分析時の高感度化を実現しています。最高倍率 100 万倍での観察が可能であり、分解能は 15kV 時 0.8nm、1kV 時 1.1nm となっています。また、エネルギー分散型 X 線分光装置(EDX)を組み込んでおり、試料の材料に起因する組成コントラストによる組成像や試料に含まれる化学物質組成の分析を行い、分析位置を示す画像と合わせて保存することができる。 |

